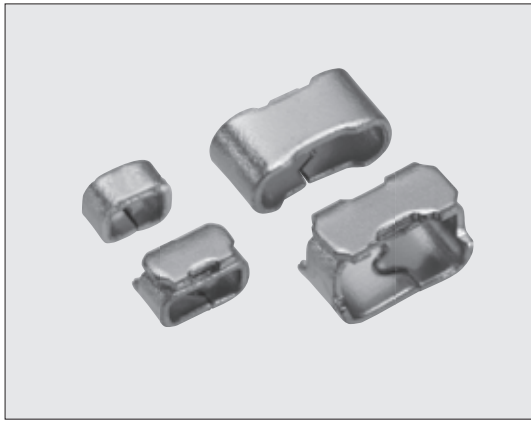
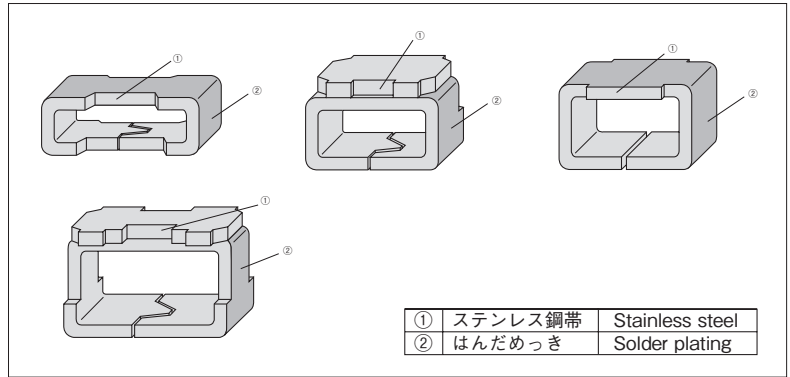


## RCU・RCT・RCS・RCW チェッカーチップ Checker Chips



### ■構造図 Construction



### ■品名構成 Type Designation

例 Example

| RCU                      | C                                      | TE   |
|--------------------------|--|--|
| 品 種<br>Product<br>Code   | 端子表面材質<br>Terminal<br>Surface Material | 二次加工<br>Taping   |
| RCU<br>RCT<br>RCS<br>RCW | C : SnCu                               | TE: 4mm pitch plastic embossed (7 inch reel)<br>TED: 4mm pitch plastic embossed (10 inch reel) (Not RCW)<br>BK: Bulk |

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せください。

テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。

Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.

For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

### ■特長 Features

- 表面実装可能なチップ形チェック端子です。
- 通常のチップマウンターで、自動搭載が可能です。
- 用途にあわせて3.2×1.6タイプ、2.0×1.25タイプ、1.6×0.8タイプの中から選ぶことができます。(3.2×1.6タイプには、高さ1.25mm及び2mmの2種類があります。)
- フロー、リフローはんだ付けに対応します。
- 外側表面のみ、はんだめっきを施しているため、内部にははんだが付かない構造です。
- 欧州RoHS対応品です。
- AEC-Q200に対応(データ取得)しています(RCU)。
- Surface-mountable chip type check terminals.
- Automatic mounting can be done by an ordinary chip mounter.
- Inch size code 1206, 0805 and 0603 are available.  
(for size 1206, two kinds of the height 1.25mm and 2mm are provided.)
- Suitable for both flow and reflow solderings.
- Since only the outside surface is solder-plated, the inside is structured unsolderable.
- Products meet EU-RoHS requirements.
- AEC-Q200 qualified (RCU).

### ■用途 Applications

- セット調整時およびセット修理時における、プリント基板上からの信号取り出し用端子
- Terminals for checking signals from a P.C. board when adjusting and repairing the set.

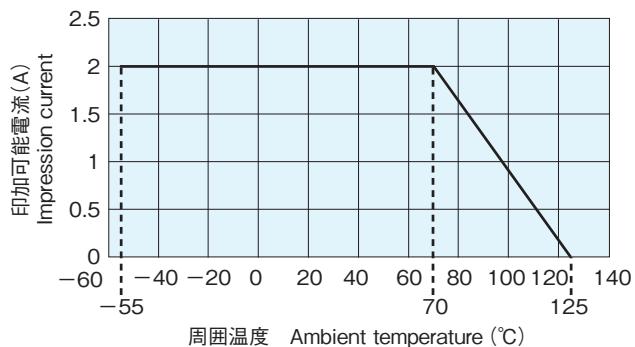
### ■定格 Rating

| 形 名<br>Type | 定格電流<br>Rated<br>Current | 抵 抗 値<br>Resistance     | 定格周囲温度<br>Rated Ambient<br>Temperature | 使用温度範囲<br>Operating<br>Temperature Range | 二次加工と包装数<br>Taping & Q'ty/Reel (pcs) |        |
|-------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|--------|
|             |                          |                         |  |  | TE                                   | TED    |
| RCU         | 2A                       | 50mΩ 以内<br>50mΩ or less | +70℃                                   | -55℃~+125℃                               | 2,000                                | 5,000  |
| RCT         |                          |                         |  |  | 2,000                                | 5,000  |
| RCS         |                          |                         |  |  | 2,000*                               | 5,000* |
| RCW         |                          |                         |  |  | 2,000                                | —      |

※RCSのテーピングは、表裏区別なく包装されます。

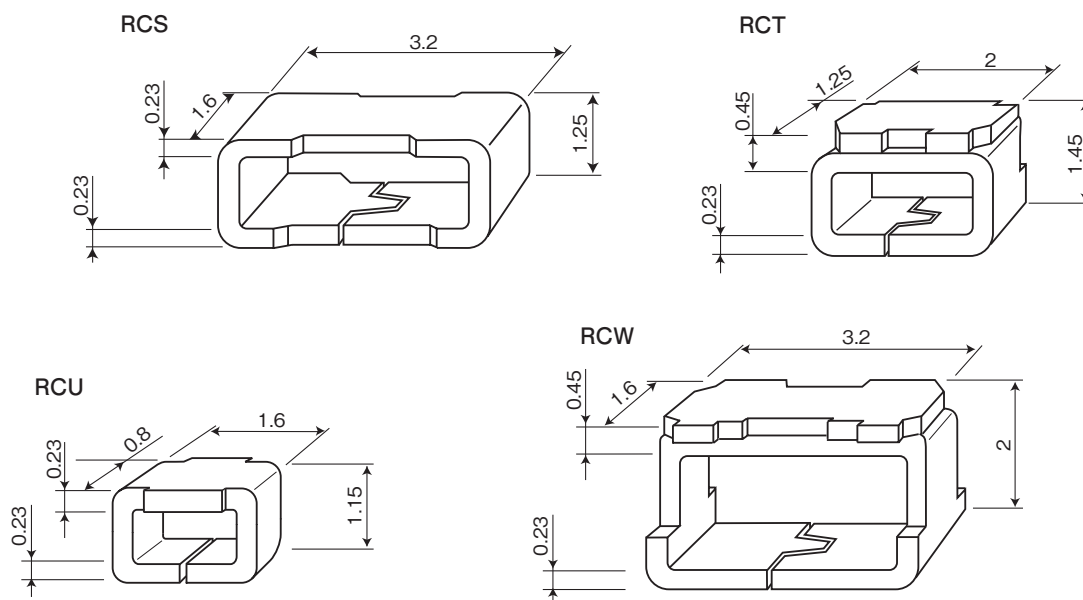
※RCS can be packaged upside down for taping.

## ■負荷軽減曲線 Derating Curve



周囲温度70℃以上でご利用される場合は、上図負荷軽減曲線に従って、印加電流を軽減してご使用ください。  
For terminals operated at an ambient temperature of 70°C or above, a impression current shall be derated in accordance with the above derated curve.

## ■外形寸法 Dimensions (mm)



| 形名<br>(Inch Size Code) | Type | Weight (g)<br>(1000pcs) |
|------------------------|------|-------------------------|
| RCU<br>(0603)          |      | 6.4                     |
| RCT<br>(0805)          |      | 13.9                    |
| RCS<br>(1206)          |      | 21.5                    |
| RCW<br>(1206)          |      | 26.8                    |

端子  
Terminal

## ■性能 Performance

| 試験項目<br>Test Items                     | 規格値 Performance Requirements       |                                    | 試験方法<br>Test Methods                        |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  | 保証値<br>Real R                      | Limit                              |   |
| 抵抗値<br>Resistance                      | 50mΩ以下<br>50mΩ Max. after the test | 10mΩ以下<br>10mΩ Max. after the test | 25°C  |
| はんだ耐熱性<br>Resistance to soldering heat | 50mΩ以下<br>50mΩ Max. after the test | 10mΩ以下<br>10mΩ Max. after the test | 260°C±5°C, 10s±1s                           |
| 温度急変<br>Rapid change of temperature    | 50mΩ以下<br>50mΩ Max. after the test | 10mΩ以下<br>10mΩ Max. after the test | -55°C (30min.) / +125°C (30min.) 100 cycles |
| 高温放置<br>High temperature exposure      | 50mΩ以下<br>50mΩ Max. after the test | 10mΩ以下<br>10mΩ Max. after the test | +125°C, 240h                                |

## ■使用上の注意 Precautions for Use

- プローブの接続につきましてはチップが脱落することがありますので、引張荷重・検測針の押荷重は1kgf以下としてください。
- Regarding the connection of probes, pulling and pushing load at the measurement and inspection pointer must be 1kgf or less because the chips may drop off.